

## Dr. Susanne Lachenmann

Mitglied des Aufsichtsrats der  
Infineon Technologies AG seit 2015



### Persönliche Daten

Geburtsdatum: 2. April 1967

Nationalität: deutsch

### Ausbildung

1995 Promotion (Dr. rer. nat.), Eberhard-Karls-Universität Tübingen

1993 Diplom im Fach Physik, Eberhard-Karls-Universität Tübingen

### Beruflicher Werdegang

Seit 2008 Leitende Entwicklungsingenieurin für Design Enabling & Services, Infineon Technologies AG

Designmethodik, Physikalische Verifikation (Senior Staff Engineer)

2005 – 2008 Entwicklungsingenieurin, Qimonda AG

Design für KERF und Testchips

1999 – 2005 Entwicklungsingenieurin für Halbleiterspeicher, Infineon Technologies AG

Diverse Designbereiche: KERF und Testchips, Embedded DRAM; Designmethodik, Technologiepaketentwicklung

1998 – 1999 Entwicklungsingenieurin für Halbleiterspeicher, Siemens AG

Designmethodik, Technologiepaketentwicklung

1995 – 1998 Wissenschaftliche Angestellte am Institut für Schicht- und Ionentechnik, Forschungszentrum Jülich